



OPTIMIERT FÜR ALLE ARTEN DER LEITERPLATTENPRODUKTION



SPARROW

MTS 30



- > Bis zu 1.152 Pins
- > Kleiner Flächenbedarf – 19 Zoll tragbares Rack
- > Sehr flexible Einsatzmöglichkeiten
- > Einfache Integration in In-Line-Systeme und/oder 19" Racks
- > Schnellwechselschnittstelle für einfache Wartung
- > Analoger und digitaler In-Circuit-Test (Low Voltage Technologie), Funktionstest, EOL-Test, Boundary Scan
- > 1:1 nicht gemultiplexte Pinarchitektur
- > Als Lambda Edition für echtes Paralleltesten erhältlich

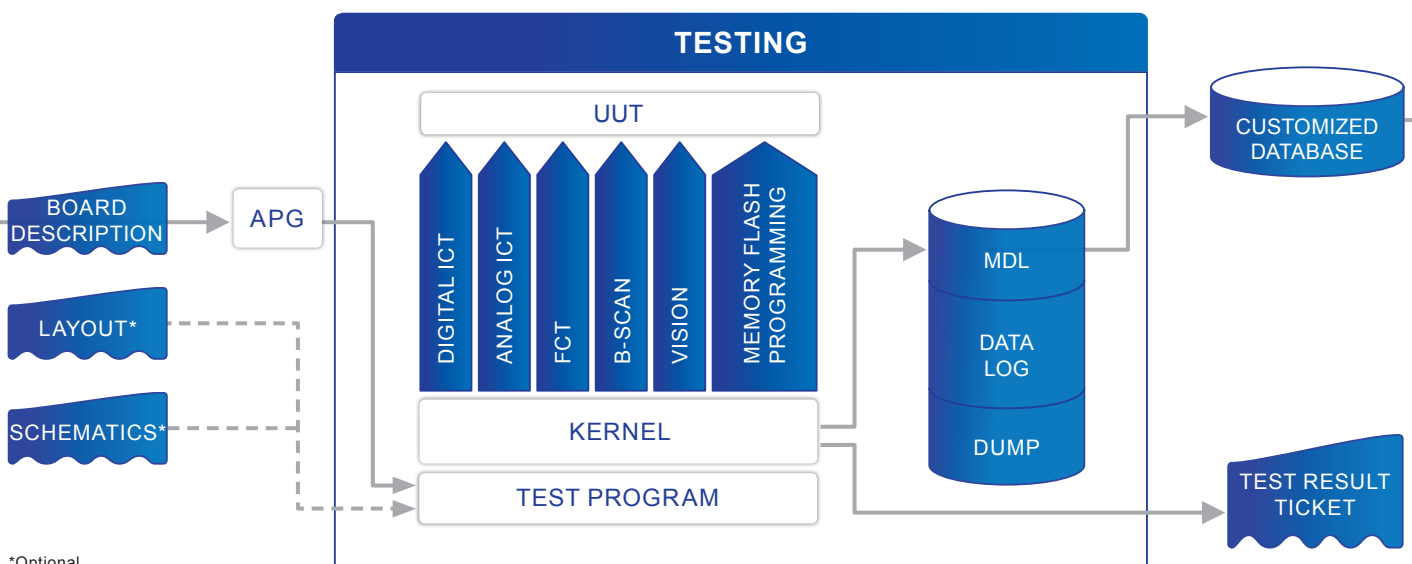


Der Sparrow bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Testfähigkeit bei geringem Platzbedarf.



CITE

COMPUTER INTEGRATED TEST ENVIRONMENT



*Optional



SPARROW HARDWARE BASISSYSTEM

19" Gehäuse

483 mm Breite x 178 mm Höhe x 570 mm Tiefe

Steuerung

Industrie PC

ICT Messungen (AMU)

Vier-Quadrant-Messungen

Guard Verhältnis	1:1000
3 Spannungsquellen	(AC/DC) 0 - 100 V
Frequenz	DC - 100 kHz
Strom	Bis zu 250 mA

Messung

Spannung	(AC/DC) bis zu 100 V
Strom	(AC/DC) bis zu 100 mA
Widerstände	0,1 Ohm - 100 MOhm
Kondensatoren	1 pF - 100 mF
Induktivitäten	10 µH - 10 H

Kelvin Messung

Diode und Zener Diode vorwärts und rückwärts bis zu 100 V

Transistor, Optokoppler usw. im aktiven Test

6-Bus Reed-Relais-Matrix (MUX)

ANALOGES ODER HYBRIDES SYSTEM

Analoger ICT

Bis zu 1.152 Pins in 128-er Schritten

Hybrider digitaler Treiber/Sensor

Bis zu 1.152 Pins in 64/128-er Schritten

Input/Output	±10 V in 20 mV Auflösung
Max. Strom	±500 mA (Backdriving) oder 50 mA für den statischen I/O Betrieb

Tri-State Fähigkeit

Automatische Treiber-Pegel-Überwachung

Treiber-Pegel pro Pin programmierbar

HARDWARE OPTIONEN

Programmierbare Spannungsquellen (UPC)

Ausgangsspannung Auflösung	2,2 mV
Genauigkeit	20 mV
Strombegrenzung Auflösung	2,5 mA
Genauigkeit	±50 mA

Kurzschlussüberwachung über Soft- und Hardware

Ausgang per Software zu- und abschaltbar

Getrennte Force- und Sense-Leitungen

Thermische Abschaltung

UPC02-09	9 V / 10 A
UPC02-25	24 V / 5 A
UPC02-45	45 V / 3,5 A

Frequenz-/Zeitmesseinheit (MTC)

Bis zu 100 MHz

DC/AC Stromversorgung und Spannungsgleichrichter (MSM)

Zusätzliche exakte U/I-Signalquellen (potentialfrei)

Zusätzliche exakte U/I-Messung (potentialfrei)

FailSim

Automatische Überprüfung der Testprogrammqualität

Externe Module

Zum Beispiel IEEE, PXI, USB, RS232, CAN, LIN uvm.

CITE TESTSYSTEM SOFTWARE (INKLUSIVE)

Programmentwicklung

Automatische Programm Generierung (APG) erstellt das Testprogramm aus der Baugruppenbeschreibung.

Bibliothek für analoge und digitale IC's.

Funktionstests erstellen mit Menu Aided Programming (MAP).

Programmiercode des Testprogramms in Visual Basic (VB) 6, VB .NET und/oder als tabellenbasiertes GenFast.

Übersetzung der Testprogramme von gängigen Testsystemen und der gesamten MTS-Serie.

Aufzeichnung aller Testergebnisse für die Rückverfolgbarkeit (Fehlerdaten und/oder komplette Messwerte).

Programm Debugging

Leistungsfähiges Debugging mit dem tabellenbasierten GenFast (vor allem für analoge ICT) und/oder alle Funktionen die in VB 6 und VB .NET zur Verfügung stehen.

Einzelschritt-Modus verfügbar.

Debug-Fenster zur Anzeige der Messergebnisse.

Alle Befehlsparameter können verändert und die Auswirkungen direkt sichtbar gemacht werden.

Der Layout- und Schaltplan-Viewer (optional) sowie die Hervorhebung fehlerhafter Komponenten erleichtern das Debuggen.

Selbsttest

Prüft die Hardware und lokalisiert fehlerhafte Module (Diagnose auf Relais-Ebene).

QCAM (Teststabilitätsbericht)

Berichtet über die Testprogrammqualität und -stabilität; macht das Debuggen einfach und effizient.

SOFTWARE OPTIONEN

C-LINK Design to Manufacturing Software

Erstellt automatisch Adapterdaten, Netzlisten, Stücklisten, Layoutdaten usw.

QMAN Qualitätsmanagement-Software

Papierlose Reparatur, Statistiken, Qualitätsmanagement, Fehlerkatalog.

Boundary Scan

Integration Boundary Scan: Entwicklung, Umsetzung und Diagnose.

LabView und TestStand

Einbindung von National Instruments LabView oder TestStand möglich.

Das Unternehmen

Digitaltest ist ein starker Partner der Elektronikindustrie und verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Implementierung und Unterstützung automatisierter Testsysteme (ATE) für bestückte Leiterplatten. Das komplette Leistungsspektrum umfasst neben Technik und Hardware auch die notwendige Software zur Automatisierung der Produktion bis hin zur Qualitätsmanagement-Software.

Digitaltest GmbH

Lorenzstraße 3
76297 Stutensee
Telefon +49 7244 9640-0
E-Mail info@digitaltest.de

